

Auswertung von Messungen

Teil I

1. Ergebnisdarstellung
2. Rechnen mit Messwerten - Signifikante Stellen
3. Linearisierung
4. Ausgleichsgerade - lineare Regression
5. Messabweichungen
6. Häufigkeitsverteilung – Histogramm
 - Lageparameter
 - Mittelwert
 - Varianz
7. Fehlerfortpflanzungsgesetze
8. Güte der linearen Regression
 - Genauigkeit der Regression
 - Korrelationskoeffizient

1. Ergebnisdarstellung

Beispiel: - Aufnahme einer Weg-Zeit-Messung : $t - x$ oder $x(t)$

- Darstellung als Wertetabelle:

t/s	x/m	V/ ms ⁻¹
2	0.01	0.005
4	0.02	0.005
8	0.16	0.02

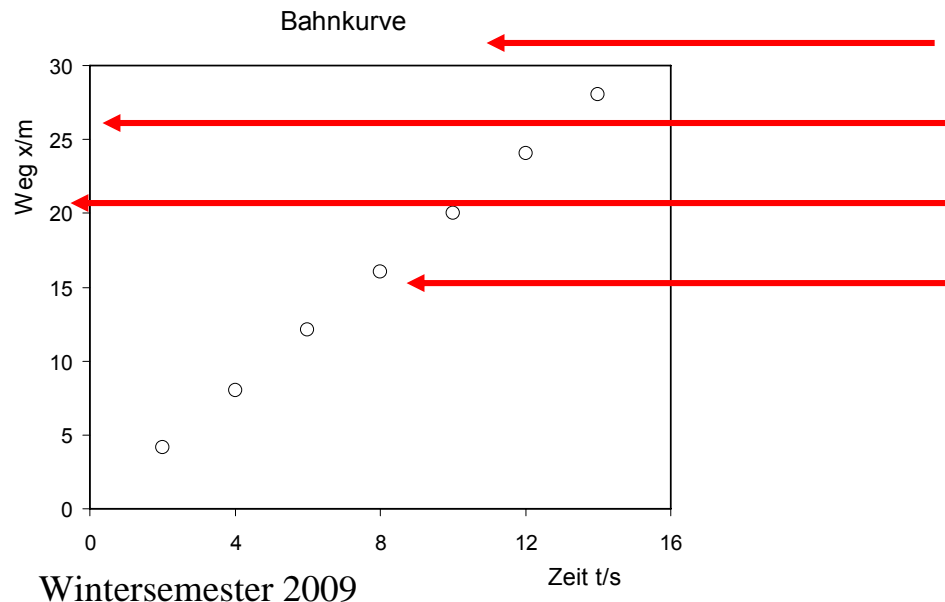
Resultat: Maßzahl · Einheit

z.B. $v = 22 \text{ m/s}$

Achtung: SI-Einheiten

m, kg, s, A, K, cd, mol

- Grafische Darstellung



2. Rechnen mit Messwerten

$$L = 72 \text{ cm}, t = 13.3 \text{ s} \longrightarrow v = \frac{L}{t} = 0.054135559... \text{ m/s}$$

Beachte die Messabweichungen: $\Delta L = 1 \text{ mm}$, $\Delta t = 0.1 \text{ s}$

$$L = (72,0 \pm 0,1) \text{ cm} \qquad t = (13,3 \pm \overset{0,1}{\underset{0,1}{0,1}}) \text{ s}$$

$$v_{\min} = \qquad \text{cm/s} = \mathbf{0.053\ 656\ 71..} \text{ m/s}$$

$$\overset{71,9}{\underset{13,4}{v}}_{\max} = \qquad \text{cm/s} = \mathbf{0.054\ 621\ 21..} \text{ m/s}$$

$$\Delta v = \frac{1}{2} (v_{\max} - v_{\min}) \cong 0.000\ 482\ 24.. \text{ m/s}$$

Formales Ergebnis: $v = (0.054\ 135\ 559.. \pm 0.000\ 482\ 24..) \text{ m/s}$

Wie viele Stellen darf das Ergebnis haben?

In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Ausbildung mehr
als an einer übertrieben genauen Rechnung

(C.F.Gauß)

Beachte:

Jedes Messergebnis ist mit einer Messunsicherheit
behaftet, die damit die signifikanten Stellen bestimmt!

Beispiel: Messung mit dem Zollstock $L = 135,3 \text{ cm}$
Messunsicherheit 1 mm

Die Anzahl der Ziffern eines Ergebnisses wird durch die
signifikanten Stellen gekennzeichnet!

Signifikante Stellen

Bei jeder Ergebnisangabe sollte die **letzte signifikante** Stelle des Ergebnisses *an der gleichen* Dezimalstelle stehen wie die **letzte signifikante** Stelle der Meßunsicherheit.

$$v = (0.054 \mathbf{13559} \pm 0.000 \mathbf{5}) \text{ m/s}$$

also: $v = (0.054 \mathbf{1} \pm 0.000 \mathbf{5}) \text{ m/s}$

Beispiele:

$$92.819 \mathbf{4} \pm 0.32 \longrightarrow 92.82 \pm 0.32$$

$$0.00342 \mathbf{16} \pm 0.00022 \longrightarrow (3.42 \pm 0.22) \cdot 10^{-3}$$

Was bedeutet das?

Ohne ergänzende Informationen: bei einer Einzelmessung erhält man mit 68% Wahrscheinlichkeit einen Meßwert zwischen $(3.42 - 0.22) \cdot 10^{-3}$ und $(3.42 + 0.22) \cdot 10^{-3}$

Der Aussagewert von Messwerten wird durch die signifikanten Stellen (oder Ziffern) bestimmt.

Zahl	signifikante Stellen
156.4	4
4.5300	5
$0.0018 = 1.8 \cdot 10^{-3}$	2
$0.001800 = 1.800 \cdot 10^{-3}$	4

Multiplikation, Division, Radizieren: signifikante Stellen des Resultats sind durch Zahl mit den wenigsten signifikanten Ziffern gegeben

Beispiel: $48.0 \cdot 943 = 45\,264 = 45.3 \cdot 10^3$

Addition, Subtraktion:

Das Endergebnis hat nach dem Komma so viele signifikante Stellen wie die Zahl mit den wenigsten signifikanten Stellen.

Beispiel: $3.16 + 2.7 = 5.86 = 5.9$

3. Linearisierung

Das Auge kann nur die Gerade und den Kreis als geometrische Elemente eindeutig identifizieren.

$$Y = A \cdot X + B$$

Wichtige Funktionsverläufe können in Geradengleichungen überführt werden:

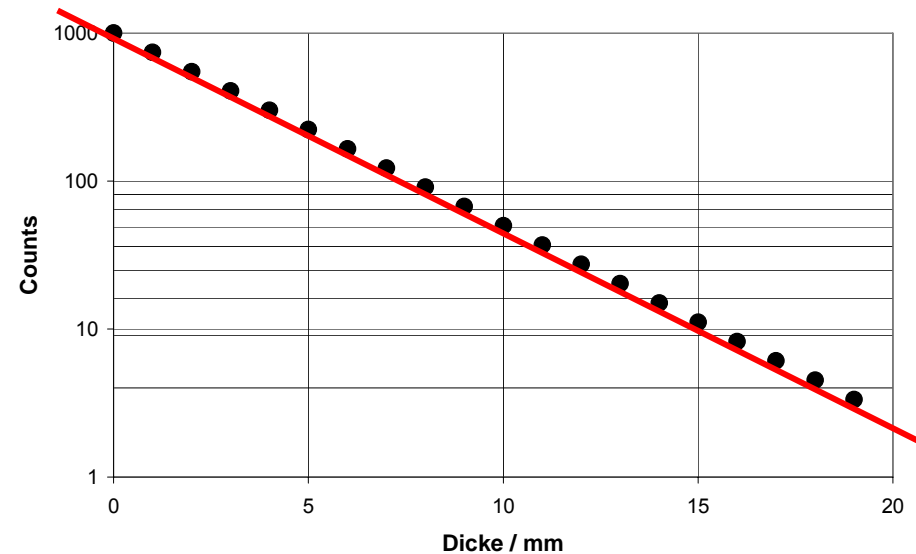
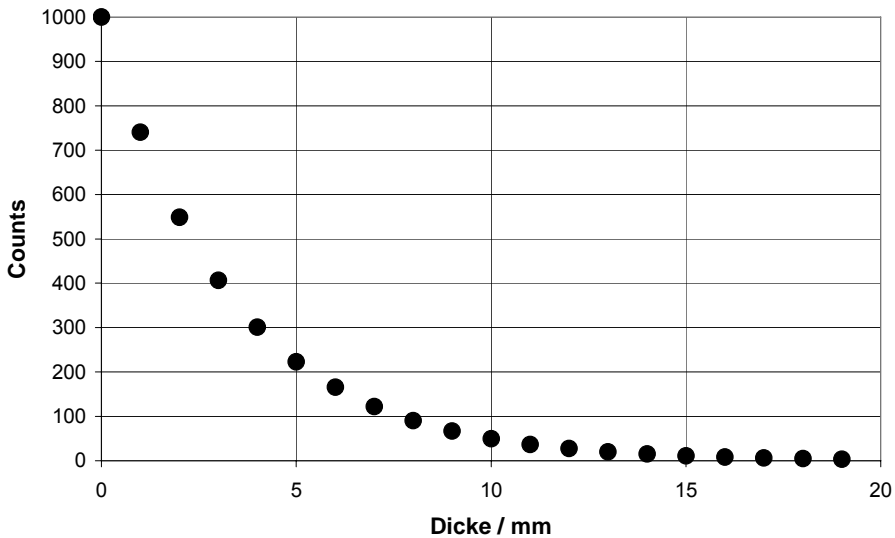
Potenzfunktion: $y = B \cdot x^A \rightarrow \ln y = A \cdot \ln x + \ln B$
doppelt-geteiltes logarithmisches Papier

Exponentialfunktion: $y = B \cdot e^{A \cdot x} \rightarrow \ln y = A \cdot x + \ln B$
einfach-geteiltes logarithmisches Papier

Exponentialgesetze

$$y = B \cdot e^{A \cdot x} \quad \rightarrow \quad \ln y = A \cdot x + \ln B$$

Beispiel: radioaktiver Zerfall $N = N_0 \cdot e^{-\mu \cdot x}$



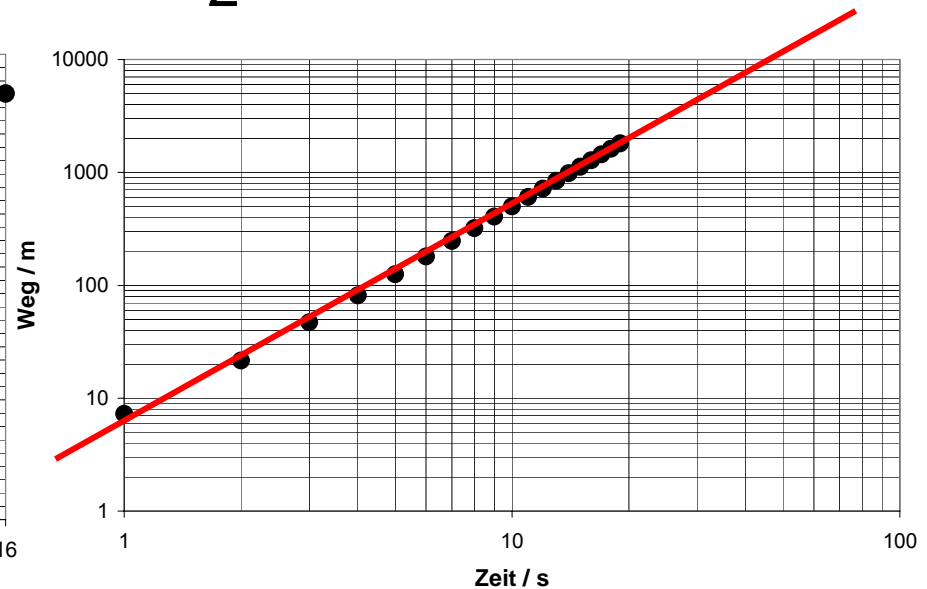
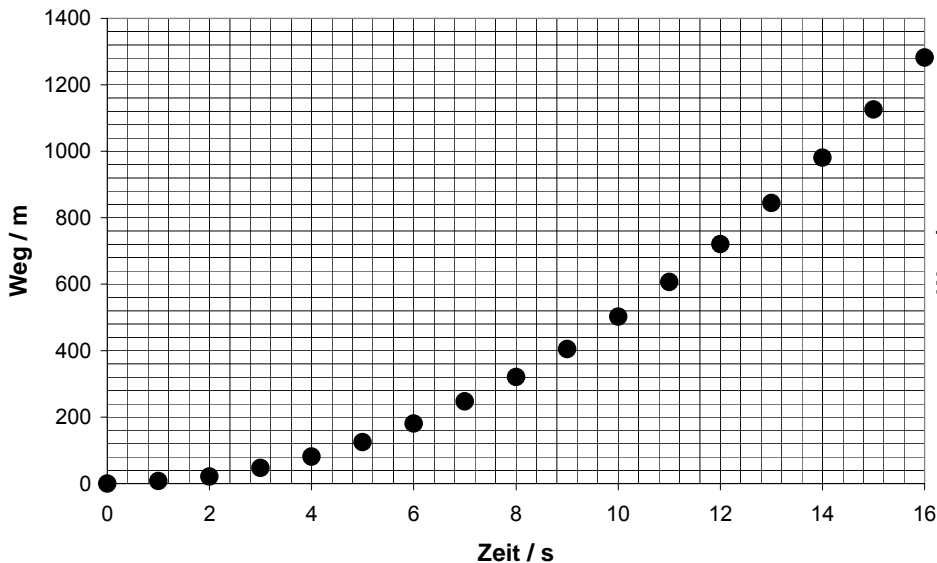
Einfach-logarithmische
Darstellung

Potenzgesetze

$$y = B \cdot x^A \quad \rightarrow \quad \ln y = A \cdot \ln x + \ln B$$

Beispiel: freier Fall

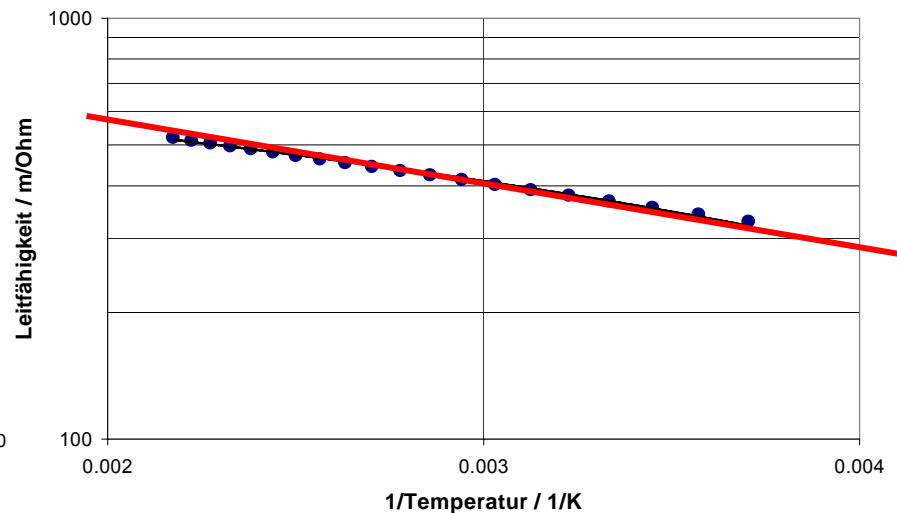
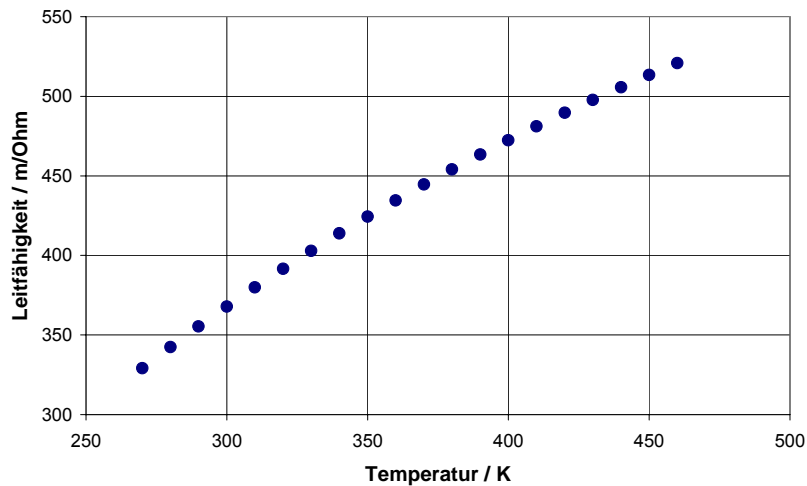
$$s = \frac{g}{2} \cdot t^2$$



Doppelt-logarithmische Darstellung

Darstellung von $e^{-\text{const} / T}$

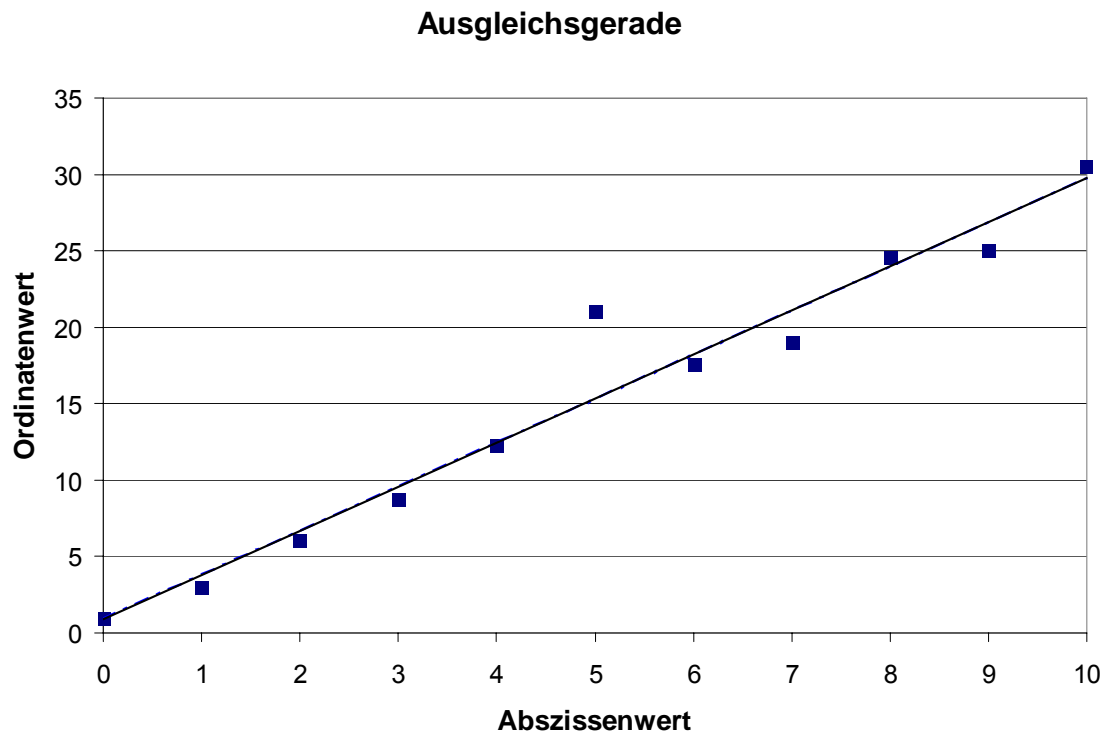
Beispiel: elektrische Leitfähigkeit im Halbleiter $\sigma(T) = \sigma_0 \cdot e^{-\frac{E}{2kT}}$

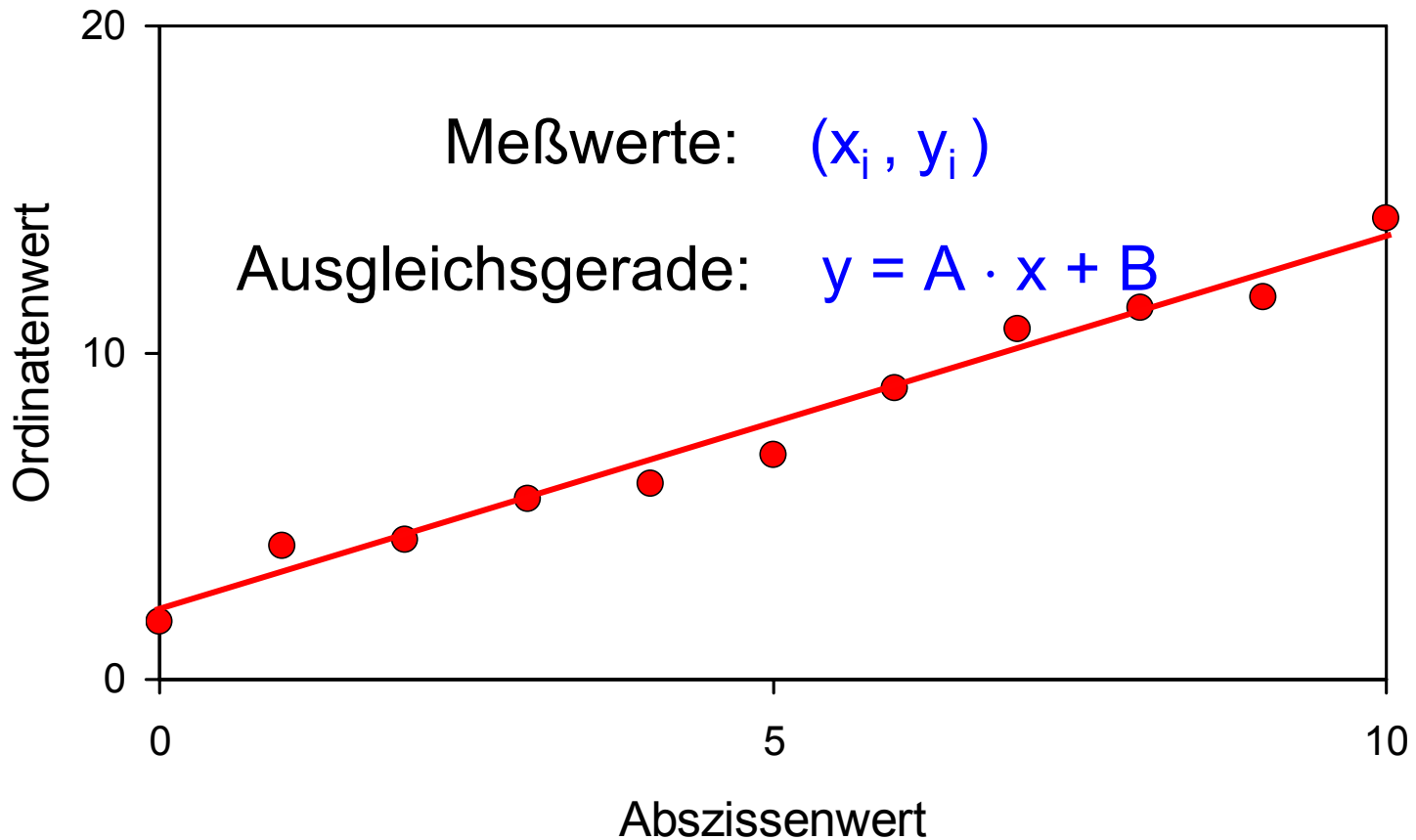


4. Ausgleichsgerade - lineare Regression

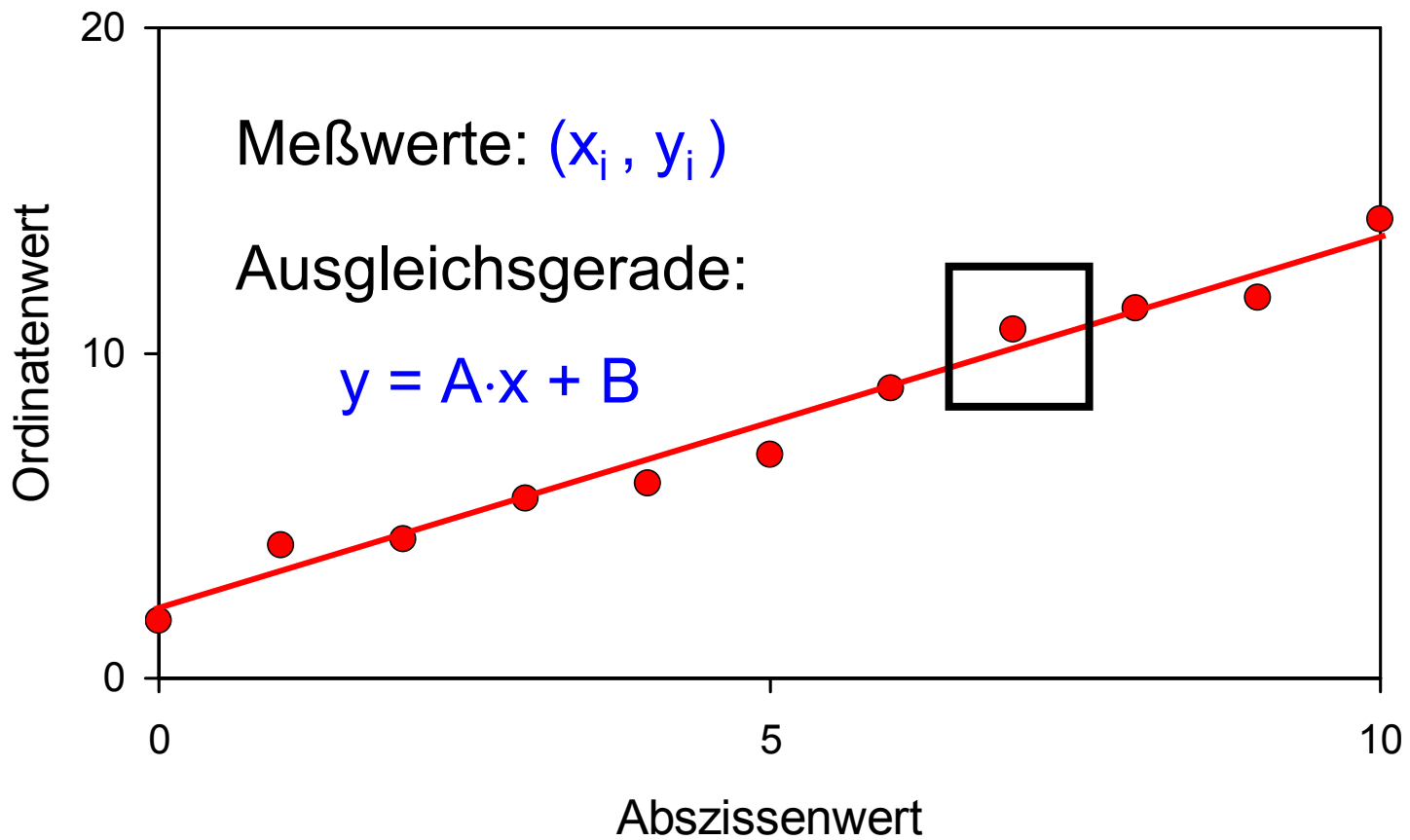
Problem: Messwerte streuen infolge Messabweichungen um eine Gerade.

Gesucht ist diejenige Gerade, die den Messwerten am besten entspricht :



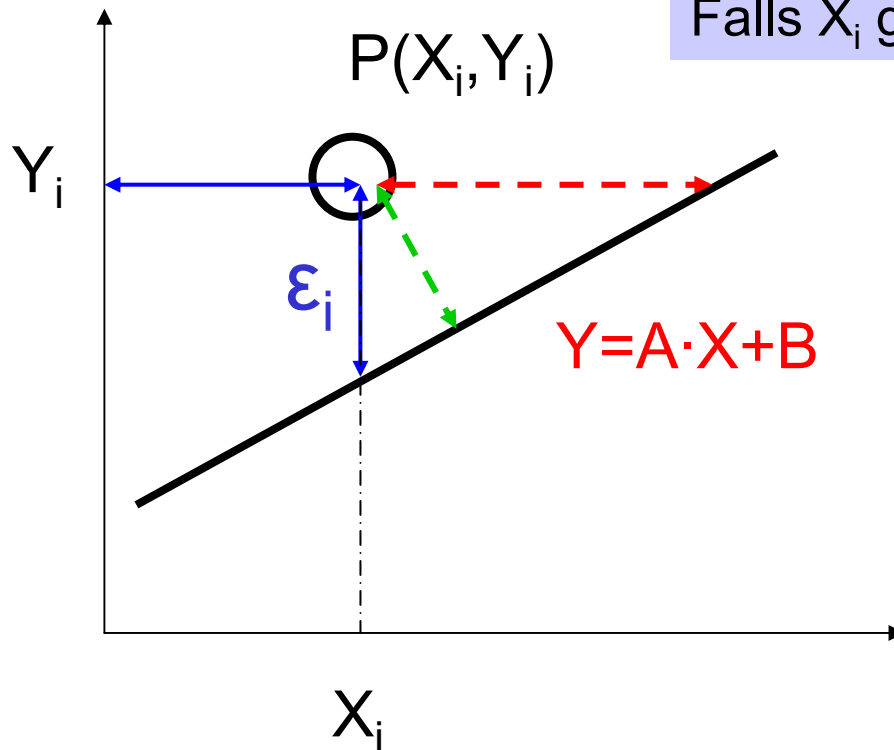


Idee: A und B so wählen, daß die Abweichungen der Meßwerte von der Ausgleichsgeraden minimal werden >>> (*Methode der kleinsten Quadrate*)



$$\sum (\text{Abweichungen})^2 = \text{Minimum}$$

Falls X_i genauer als Y_i gemessen wurde:

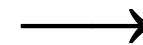


$$Y_i = A \cdot X_i + B - \varepsilon_i$$

$$\varepsilon_i = A \cdot X_i + B - Y_i$$

$$\sum \varepsilon_i^2 = \text{Minimum}$$

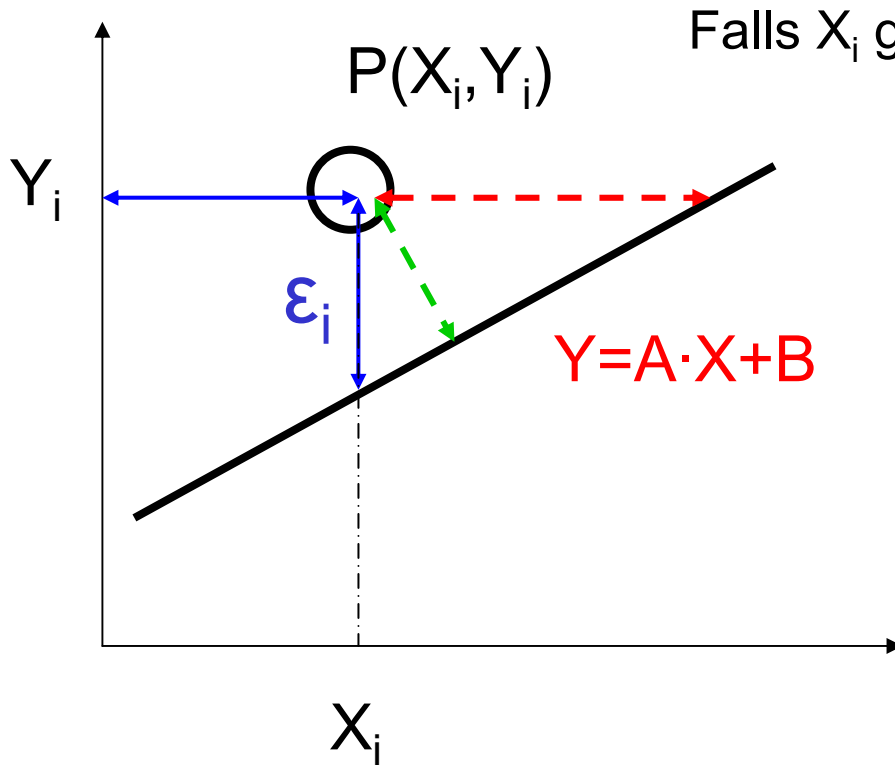
$$\varepsilon_i = f(A, B)$$



$$\frac{\partial (\sum \varepsilon_i^2)}{\partial A} = 0 !$$

$$\frac{\partial (\sum \varepsilon_i^2)}{\partial B} = 0 !$$

Auflösung der beiden Gleichungen nach den 2 Unbekannten A und B. Einführung der Mittelwerte \bar{x} und \bar{y} sowie der Varianz Q_{xx} und Kovarianz Q_{xy} .

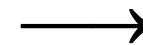


$$Y_i = A \cdot X_i + B - \epsilon_i$$

$$\epsilon_i = A \cdot X_i + B - Y_i$$

$$\sum \epsilon_i^2 = \text{Minimum}$$

$$\epsilon_i = f(A, B)$$



$$\frac{\partial (\sum \epsilon_i^2)}{\partial A} = 0 !$$

$$\frac{\partial (\sum \epsilon_i^2)}{\partial B} = 0 !$$

$$A = \frac{Q_{xy}}{Q_{xx}}$$

$$B = \bar{y} - A \cdot \bar{x}$$

$$Q_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$Q_{xy} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})$$

5. Messabweichungen

Messabweichung = Messwert - wahrer Wert

DIN 1319-1

Systematische Messabweichungen :

- bei Wiederholung der Messung reproduzierbar
- schwer erkennbar - aber korrigierbar
z.B. Anzeigefehler, Schlupf, Spannungsabfall ..

Zufällige Messabweichungen, (auch: statistische M.a.):

- können positiv und negativ sein („streuen“)
- Häufigkeit nimmt mit der Größe ab

.... die Normenarbeit geht weiter: INC-1 (1980)

Nicht mehr Unterteilung in systematische und zufällige Messabweichungen mehr sondern in:

Standardunsicherheit vom Typ A:

bei Wiederholmessung

$$u_x = \frac{S}{\sqrt{X}}$$

Standardunsicherheit vom Typ B:

wissenschaftliche Beurteilung aller Informationen über die mögliche Streuung der Messgrößen:
Fehlergrenzen, Herstellerangaben,

Dann Annahmen über den Verteilungstyp,

Angabe der kombinierten Standardunsicherheit (Quadratisches Fortpflanzungsgesetz)

Wiederholmessungen

Zur genauen Bestimmung der Meßgröße y wird die Messung mehrfach wiederholt: \longrightarrow Meßwerte y_i mit $i = 1..n$

Aus der **Messstatistik** der y_i (= Stichprobe) können der **Mittelwert** \bar{y} und die empirische **Standardabweichung** s bestimmt werden.

S^2 heißt **empirische Varianz** der Stichprobe.

Indirekte Messungen

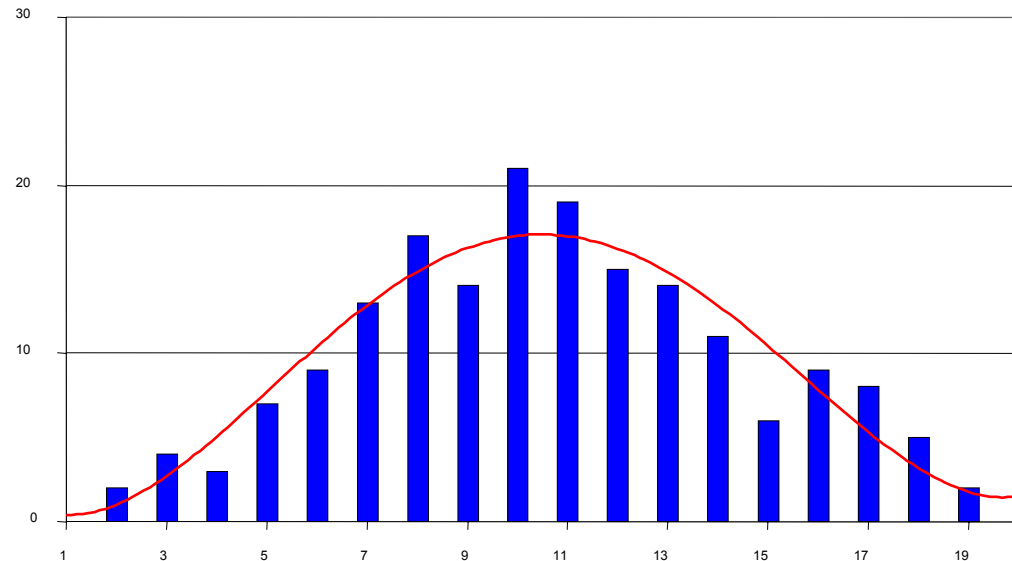
Die Meßgröße y hängt in bekannter Weise von mehreren Meßwerten x_i ab:
 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$.

Die Meßunsicherheit von y wird durch **Fortpflanzungsgesetze** beschrieben (linear oder quadratisch).

6. Häufigkeitsverteilungen

- Ursachen der *Zufälligkeit*:
- statistisch
 - nichtlinear
 - unvorhersehbar

Häufigkeitsverteilung
der Messwerte ist
darstellbar als
Histogramm

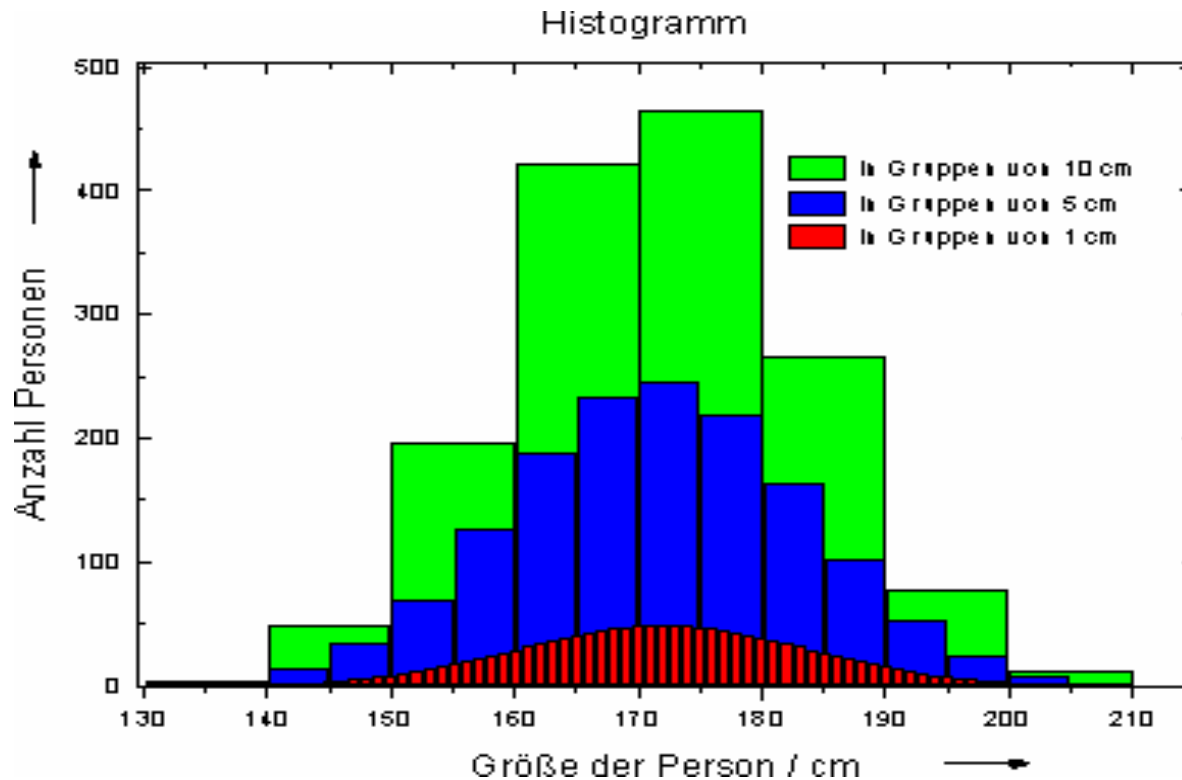


Histogramm bei unterschiedlichen Intervallgrößen

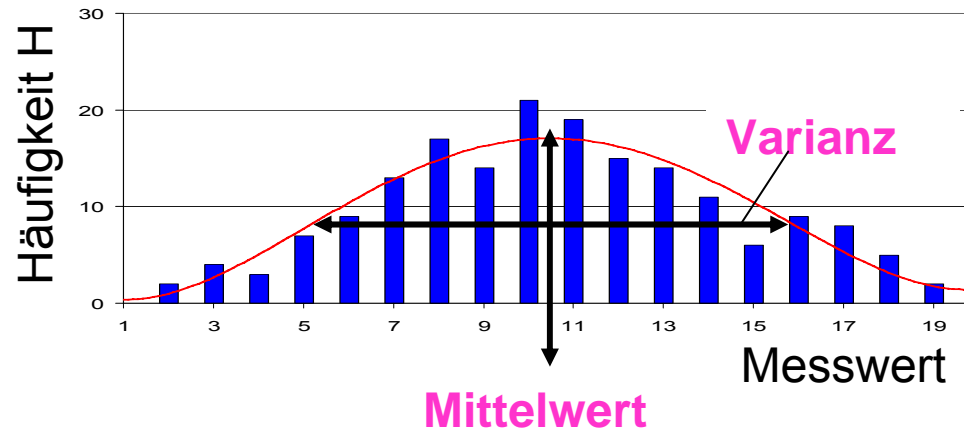
Anzahl der Ergebnisse n

Anzahl der Intervalle K

$$K = \begin{cases} \sqrt{n} & \text{für } n \leq 1000 \\ 10 \cdot \lg n & \text{für } n \geq 1000 \end{cases}$$



Lageparameter der Häufigkeitsverteilung



Verteilungsfunktion durch **Mittelwert** und Dispersionsgröße (z.B. **Varianz s^2**) charakterisieren

$$S^2(\bar{x}) = \sum_{j=1}^K H_j \cdot (x_j - \bar{x})^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

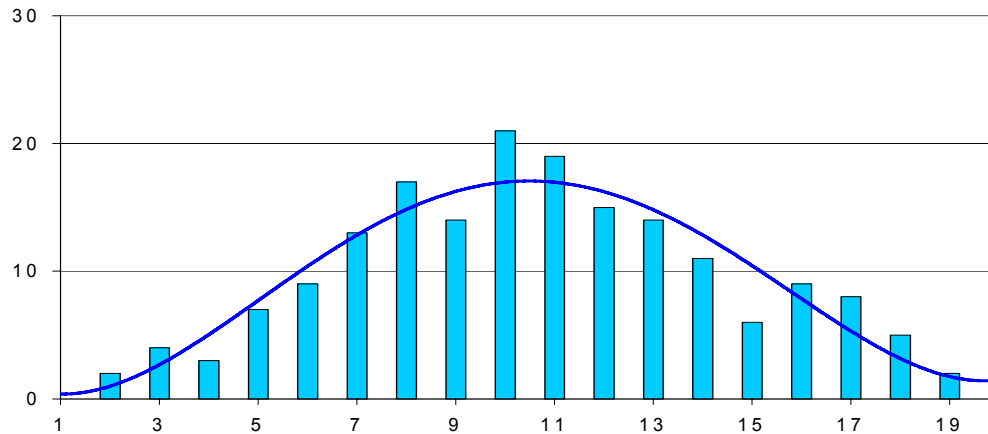
Varianz bezüglich eines anderen Wertes B

$$S^2(B) = S^2(\bar{x}) + (B - \bar{x})^2$$

Experiment - Theorie

Stichprobe i \longleftrightarrow

Grundgesamtheit,
Modellverteilung



Experiment

Theorie

\bar{x}

μ

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n-1}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \mu)^2}{n}}$$

$$s^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$$

$$\sigma^2 = \overline{x^2} - \mu^2$$

Mittelwerte

Meßwerte $\{y_i\}$

Mittelwerte

- arithmetisch:

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^N y_i}{N}$$

- geometrisch:

$$\bar{y} = \sqrt[n]{y_1 y_2 \cdots y_n}$$

- quadratisch :

$$\bar{y} = \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n y_i^2}$$

- Median :

steht in der Mitte

Warum wird der arithmetische Mittelwert bevorzugt?

Eigenschaften des arithmetischen Mittelwerts

- Summe aller Fehler verschwindet:
$$\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}) = 0$$
- Summe der Fehlerquadrate ist minimal:
$$\frac{\partial}{\partial \bar{y}} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = 0$$

Standardabweichung = Breite der Messwertverteilung um Mittelwert
= Wurzel aus Varianz

Standardabweichung s:
$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n [y_i - \bar{y}]^2}{n-1}}$$

Betrachtung von mehreren Stichproben.
Wie breit ist die Verteilung der Mittelwerte?

Hierzu folgt ein simuliertes Beispiel

Gemessen wird die Gesamtaugenanzahl X von 5 Würfeln,
jeweils gemittelt über $n = 100$ Würfe

Einzelmessungen
der Stichprobe:

$$\overline{X}_i$$

$$S_x$$

Mittelwert	Standardabweichung
16,95	4,18
16,91	4,1
17	3,43
17,42	3,45
18,2	3,9
17,14	3,74

Mittelung über alle
Stichproben:

$$\overline{X} = \frac{1}{N} \sum_n \overline{X}_i$$

$$S_{\overline{X}} = \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Mittelwert	Standardabweichung
17,47	0,39

Mittelwert und
Standardabweichung der **Stichprobe**

17,49	4
-------	---

Mittelwert und
Standardabweichung des **Mittelwerts**

--	--

Schlußfolgerungen für die Streuung der Mittelwerte

- ➔ 1 Meßreihe liefert die Messwerte x_j , aus denen der Mittelwert \bar{X}_i und die Streuung s_i der Messwerte um den Mittelwert berechnet werden.
- ➔ Die Mittelwerte \bar{X}_i vieler Messreihen verteilen sich mit der Streuung $S_{\bar{X}}$ um den wahrscheinlichsten Mittelwert \bar{X} .

Es gilt bei Messreihe mit Stichprobenumfang n für die **Standardabweichung des Mittelwerts (= Standardunsicherheit)**:

$$S_{\bar{X}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

7. Fortpflanzung von Messabweichungen

7.1 systematische Messabweichungen

Gesucht ist eine obere Schranke ΔZ

für die Messunsicherheit der **indirekt** gemessenen Größe Z , die aus mehreren unsicheren Einzelgrößen bestimmt wird !

$$Z = f(X, Y) \quad \Delta Z = \left(\frac{\partial f}{\partial X} \right) \cdot \Delta X + \left(\frac{\partial f}{\partial Y} \right) \cdot \Delta Y$$

$$Z = X \pm Y \quad \Delta Z = \Delta X + \Delta Y$$

$$Z = X \cdot Y \quad \Delta Z/Z = \Delta X/X + \Delta Y/Y$$

Im Praktikum werden gewöhnlich die Meßabweichungen mit 1..2 signifikanten Ziffern angegeben.

7.2 zufällige Messabweichungen (Gaußsches Fehlerfortpflanzungsgesetz)

- $Z = f(X, Y)$
- Unkorrelierte und zufällige Messabweichungen bei X und Y
- Standardabweichungen s_X und s_Y

Gesucht ist die **wahrscheinlichste Standardabweichung** von Z!

$Z = f(X, Y)$ bekannt: s_X, s_Y gesucht: s_Z

$$s_{\bar{Z}} = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial X}\right)_{\bar{X}}^2 \cdot s_{\bar{X}}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial Y}\right)_{\bar{Y}}^2 \cdot s_{\bar{Y}}^2}$$

s_Z wird nach DIN 1319 **kombinierte Standardunsicherheit** genannt

Gaußsches Fehlerfortpflanzungsgesetz

$$s_{\bar{Z}} = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial X}\right)_{\bar{X}}^2 \cdot s_{\bar{X}}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial Y}\right)_{\bar{Y}}^2 \cdot s_{\bar{Y}}^2}$$

$$Z = X + Y$$

$$s_Z^2 = s_X^2 + s_Y^2$$

$$Z = X \cdot Y$$

$$\left(\frac{s_{\bar{Z}}}{\bar{Z}}\right)^2 = \left(\frac{s_{\bar{X}}}{\bar{X}}\right)^2 + \left(\frac{s_{\bar{Y}}}{\bar{Y}}\right)^2$$

$$Z = x^n$$

$$s_Z = s_X \cdot n$$

$$Z = \ln X$$

$$s_Z = s_X / X$$

$$Z = e^X$$

$$s_Z = s_X \cdot Z$$

1. Beispiel für Fehlerfortpflanzung (zufällige Meßabweichungen)

Messung von g mit einem einfachen Pendel $g = g(l, T) = \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot l}{T^2}$

Abschätzung der Messunsicherheit: $\frac{\delta g}{g} = \sqrt{\left(\frac{\delta l}{l}\right)^2 + \left(2 \frac{\delta T}{T}\right)^2}$

mit $\frac{\delta l}{l} = 0,1\%$ und $\frac{\delta T}{T} = 0,4\%$

wird: $\frac{\delta g}{g} = 0,4\%$

2. Beispiel für Fehlerfortpflanzung (zufällige Meßabweichungen)

Bestimmung der Dichte von Luft : $\rho = \frac{m}{V} = \frac{m_1 - m_2}{V}$

$$V = 16.73 \pm 0.21 \text{ cm}^3$$

$$m_1 = 10.3420 \pm 0.0020 \text{ g}$$

$$m_2 = 10.3210 \pm 0.0020 \text{ g}$$

Abschätzung der Messunsicherheit:

$$\begin{aligned} \frac{s_{\rho}}{\rho} &= \sqrt{\left(\frac{s_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{s_V}{V}\right)^2} = \sqrt{\frac{s_{m_1}^2 + s_{m_2}^2}{m^2} + \left(\frac{s_V}{V}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{0.0020^2 + 0.0020^2}{0.021^2} + \left(\frac{0.21}{16.73}\right)^2} \approx \sqrt{\frac{2}{100} + (0.013)^2} \approx 0.14 \end{aligned}$$

also:

$$\frac{s_{\rho}}{\rho} = 0.14$$

8. Genauigkeit der linearen Regression

$Y = A \cdot X + B$ gegeben: σ_Y mit $\sigma_Y^2 = \frac{1}{N-2} \sum (Y_i - A \cdot X_i - B)^2$

8.1 gesucht: σ_A, σ_B , $\sigma_A^2 = \sum \left(\frac{\partial A}{\partial Y_i} \cdot \sigma_Y \right)^2$ $\sigma_B^2 = \sum \left(\frac{\partial B}{\partial Y_i} \cdot \sigma_Y \right)^2$

z.B. für σ_B : $B = \frac{\sum X^2 \cdot (Y_1 + \dots + Y_j + \dots) - \sum X \cdot (X_1 Y_1 + \dots + X_j Y_j)}{\text{Nenner}}$

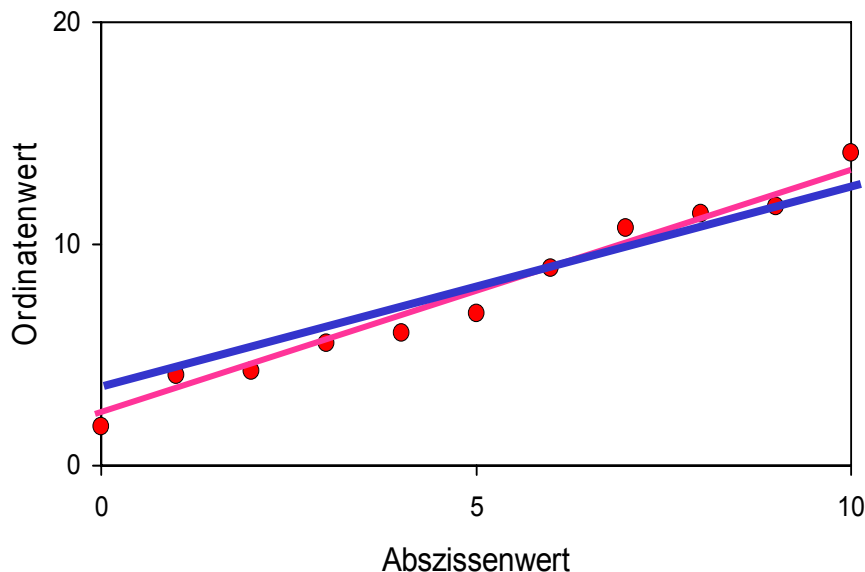
$$\frac{\partial B}{\partial Y_j} = \frac{\sum X^2 - X_j \cdot \sum X}{\text{Nenner}} \quad \sum_j \left(\frac{\partial B}{\partial Y_j} \right)^2 = \frac{N \cdot (\sum X^2)^2 - \sum X^2 \cdot (\sum X)^2}{\text{Nenner}^2} = \frac{\sum X^2}{\text{Nenner}}$$

$$\sigma_B^2 = \frac{\sigma_Y^2 \cdot \sum X_i^2}{N \cdot \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$\sigma_A^2 = \frac{N \cdot \sigma_Y^2}{N \cdot \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

8. Genauigkeit der linearen Regression

8.2 Was bedeutet der Korrelationskoeffizient?



Vertikale Abweichungen minimiert:

$$y = A \cdot x + B$$

Horizontale Abweichungen minimiert

$$x = A' \cdot y + B'$$

Bestimmtheitsmaß $R^2 = A \cdot A'$
Korrelationskoeffizient R

$$R^2 = \frac{Q_{xy}^2}{Q_{xx} \cdot Q_{yy}}$$

Anhang

- Literatur
- Bestimmung der Standardunsicherheit
- Ablaufschema zur Bestimmung der Messunsicherheit einer direkt gemessenen Größe
- Beispiel: Fadenpendel mit großer Auslenkung

Literatur

- H.Gränicher, „Messung beendet – was nun?“, Teubner 1994
- .R.Spiegel, L.J.Stephens, Statistik, McCraw_Hill 1999
- T.Elser, Statistik für die Praxis, Wiley 2004
- L.Squires, Messergebnisse und ihre Auswertung, 1971
- J.Mandel, The statistical analysis of experimental data, 1984
- M.Drosg, Umgang mit Unsicherheiten, facultas 2006
- L.Kirkup, B.Frenkel, Uncertainty in Measurements, Cambridge 2006
- J.R.Taylor, Fehleranalyse VCH 1988

- DIN 1319, Teil 3 und 4 Messunsicherheiten
- DIN 55350, Teil 13 Messunsicherheiten